

XRD



Başlıca Uygulamalar

- Bilinmeyen örneklerdeki kristal fazların tanımlanması
- Oran tayini (Rietveld analizi ile)
- Kristal Boyutu & Mikrogerilme (Şerrer formülü ile tahmin)
- Kristal düzlemlerinin yönelim analizi
- Özgül yönlerdeki iç gerilmelerin belirlenmesi (Artık Gerilme Ölçümü)
- İnce film karakterizasyonu (Kalınlık, gerilme, fazlar, epitaksiyel yapı)

Numune Tipleri

Toz: Ø10–25 mm, 1–5 mm
Bulk: ≤30×30 mm, <10 mm (düz yüzey)
İnce film: Ø10–25 mm substrat
Metal: Ø10–20 mm, <10 mm
Seramik/Cam: Ø10–25 mm, <5–8 mm

Teknik Özellikler

Gerilim-Stres analizi, Faz tanımı, Rietveld analizi yapılmaktadır.

Bakır (Cu) ve Kobalt (Co) tüp ile çalışmakta olup min. gücü 1.5kW

-10° ile +150° aralığında açısız tarama yapılmaktadır

5 Eksenli Stage ile tarama (x,y,z,chi,phi)

Dönerek test ile daha detaylı bir analiz sonucu

FSMVÜ HALIÇ YERLEŞKESİ, ALÜMİNYUM TEST EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi, Haliç Yerleşkesi Sütluçe Mahallesi Halicioğlu Kavşağı No:12 Beyoğlu/İstanbul

☎ 0212 521 81 00-Dahili:4373

✉ aluteam@fsm.edu.tr

🌐 aluteam.fsm.edu.tr